

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#)   [Publications/Services](#)   [Standards](#)   [Conferences](#)   [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore™**  
RELEASE 1.4Welcome  
United States Patent and Trademark Office[Help](#)   [FAQ](#)   [Terms](#)   [IEEE Peer Review](#)**Quick Links**

» S

Welcome to IEEE Xplore® Your search matched [0] of [792573] documents.

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

**Tables of Contents**

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

**Search**

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

**Member Services**

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)

[Print Format](#)

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)  
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)  
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2002 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#)   [Publications/Services](#)   [Standards](#)   [Conferences](#)   [Careers/Jobs](#)

RELEASE 1.4

Welcome  
United States Patent and Trademark Office[Help](#)   [FAQ](#)   [Terms](#)   [IEEE Peer Review](#)**Quick Links**

&gt;&gt; S

**Welcome to IEEE Xplore®**[Home](#)[What Can I Access?](#)[Log-out](#)**Tables of Contents**[Journals & Magazines](#)[Conference Proceedings](#)[Standards](#)**Search**[By Author](#)[Basic](#)[Advanced](#)**Member Services**[Join IEEE](#)[Establish IEEE Web Account](#) [Print Format](#)Your search matched **1 of 792573** documents.Results are shown **15** to a page, sorted by **publication year** in **descending** order.You may refine your search by editing the current search expression or entering a new one the text box Then click **Search Again**.**Results:**Journal or Magazine = **JNL** Conference = **CNF** Standard = **STD****1 An experimental Japanese/English interpreting video phone system***Karaorman, M.; Applebaum, T.H.; Itoh, T.; Endo, M.; Ohno, Y.; Hoshimi, M.; T.; Matsui, K.; Hata, K.; Pearson, S.; Junqua, J.-C.*

Spoken Language, 1996. ICSLP 96. Proceedings., Fourth International Conference , Volume: 3 , 1996

Page(s): 1676 -1679 vol.3

[\[Abstract\]](#)   [\[PDF Full-Text \(416 KB\)\]](#) **CNF**[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)  
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)  
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2002 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)



[Membership](#)   [Publications/Services](#)   [Standards](#)   [Conferences](#)   [Careers/Jobs](#)

# IEEE Xplore™

RELEASE 1.4

[Help](#)   [FAQ](#)   [Terms](#)   [IEEE Peer Review](#)

## Quick Links

» Adv

Welcome  
United States Patent and Trademark Office

### Welcome to IEEE Xplore®

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

### Tables of Contents

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

### Search

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

### Member Services

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)

- 1) Enter a single keyword, phrase, or Boolean expression.  
Example: acoustic imaging (means acoustic and imaging)
- 2) Limit your search by using search operators and field codes, if desired.  
Example: optical <and> (fiber <or> fibre) <in> ti
- 3) Limit the results by selecting Search Options.
- 4) Click Search. See [Search Examples](#)

text-to-speech and local  
and remote



[Start Search](#)

[Clear](#)

Note: This function returns plural and suffixed forms of the keyword(s).

Search operators: <and> <or> <not> <in> [More](#)

Field codes: au (author), ti (title), ab (abstract), ct (conference title), jn (journal name) [More](#)

### Search Options:

#### Select publication types:

- Journals
- Conference proceedings
- Standards

#### Select years to search:

From year:   to

#### Organize search results by

Sort by:   
In:  Descending  order  
List  15  Results per pag

---

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)  
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)  
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2002 IEEE — All rights reserved